Flash Speicher

HAW Hamburg

Fach: Informatik 2 Prof: Prof. Edeler Datum: 20.01.2017

Name: Shiwam Arora

Matrikel Nr: 2270256

Flash Speicher:

- digitale Bausteine
- Gruppe der EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-only Memory)
- Flash-EEPROM
- Speichertechnik
- schnell
- wiederverwendbar
- geringer Energieverbrauch
- permanenter Speicher, ohne Energiezufuhr
- blockweise beschreiben und löschen (64, 128, 256, 1024, ... Byte)

Produzenten: Einsatz:
> Samsung > Handy
> Toshiba > USB-Stick
> Western Digital / San Disk > Speicherkarte

> SSD

> BIOS Speicher im PC

Architektur:

NOR-Flash

NAND-Flash

MLC (Multi Level Cell)

TLC (Tripple Level Cell)

NOR-Flash:

- > Speicherzellen Parallel verschaltet
- > Architektur erfordert mehr Platz
- > komplizierte Fertigung
- > fehlerfrei
- > teuer
- > direkter Zugriff auf Speicherzelle
 - -> kurze Zugriffszeit, schnelle Lesezeit
- > schreiben und löschen nur Blockweise möglich
- > mehr Schreib- und Löschzugriffe
- > Einsatz in Microcontroller, BIOS für PC

NAND-Flash

- > Speicherzellen in einer Reihenschaltung
- > 2/5 des Flächenbedarfs vom NOR-Flash
- > einfache Fertigung
- > kostengünstig
- > mehr Speicherplatz als NOR-Flash
- > lesen, schreiben und löschen nur in Blöcken
- > Einsatz in SSD, USB-Stick, Handy, etc.
- > beschädigte Speicherblöcke ab Werk

| | SLC | MLC | TLC |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bit pro Zelle | 1 Bit | 2 Bit | 3 Bit |
| speicherbare Zustände | 2 (2^1) | 4 (2^2) | 8 (2^3) |
| Lebensdauer | ca. 100.000 Schreibvorgänge | ca. 3.000 Schreibvorgänge | ca. 1.000 Schreibvorgänge |
| Fehlerrate | sehr niedrig | mittel | hoch |
| Geschwindigkeit | sehr hoch | niedrig | niedrig |
| Stromverbrauch | sehr niedrig | hoch | hoch |
| Kosten | hoch | niedrig | niedrig |

Warum geht eine Speicherzelle kaputt?

- > Floating-Gate wird mit einer Spannung von 10-18 Volt geladen (Schreibzugriff)
- > Oxidschicht (Isolation) wird überwunden
- > Oxidschicht wird bei jedem Schreibzugriff beschädigt
- >Oxidschicht isoliert nicht mehr
 - -> Elektronen können nicht mehr im Floating-Gate gehalten werden
 - -> Speicherzelle wird unbrauchbar

Vorteile von Flash-Speicher

- > Daten bleiben ohne Energiequelle gespeichert
- > geringer Energieverbrauch
- > geringe Wärmeentwicklung
- > geräuschlos
- > unempfindlich gegen Erschütterungen, Magnetfelder und Luftfeuchtigkeit
- > kurze Zugriffszeit
- > schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeit
- > einfaches Auslesen des Speichers
- > kleine Bauformate möglich
- > Lange Haltbarkeit der Daten, da keine mechanischen Verschleißteile

Nachteile von Flash-Speicher

- > hoher Preis
- > begrenzte Schreib- bzw. Löschvorgänge
- > Speicher muss gelöscht werden um neu beschrieben zu werden
 - -> beschleunigt Abbau der Isolierschicht
- > nur Blockweise beschreib- und löschbar
- > eigener Controller wird für Ansteuerung benötigt

Funktionsweise:

- > Speicherzelle besteht aus speziellem Feldeffekttansistor
 - -> Floating-Gate-Transistor
- > Floating-Gate ist gegen Drain. Source und Control-Gate mit einer Oxidschicht isoliert
- > Oxidschicht verhindert das Abfließen der Ladung
- > permanente Speicherung von Daten in Form von Elektronischer Ladung

Floating-Gate laden (schreiben):

- > Hohe positive Spannung am Control-Gate >10 Volt
- > Tunnel zwischen Drain und Source öffnet sich
- > Drain und Source übertragen Elektronen in das Floating-Gate
- > Floating-Gate speichert die Elektronen

Floating-Gate entladen (löschen):

- > hohe negative Spannung am Control-Gate >-10 Volt
- > Tunnel zwischen Drain und Source öffnet sich
- > Floating-Gate überträgt Spannung an Source und Drain durch den Tunnel
- > Floating-Gate verliert gespeicherte Elektronen
- > Oxidschicht nimmt Schaden an